

电子元器件如何进行冷热冲击试验

产品名称	电子元器件如何进行冷热冲击试验
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	13378656621 13378656621

产品详情

1、前言

1.1 目的

确定元件暴露于高低温极值下，以及高低温极值交替冲击下所具有的抗御能力。

1.2 应用

试验样品的失效数应以后检测为依据。

2、试验条件

2.1 极值温度及循环次数

见表1。

2.2 极值温度下的试验时间

见表2

3、对试验 设备的要求

3.1 冷热冲击试验箱应能提供第2章表1所规定的极值温度条件。

3.2 冷热冲击试验箱应符合GJB360.1-87《电子及电气元件试验方法 总则》第4.4条a的规定。

3.3冷热冲击试验箱应有足够的热容量，以便试验样品放入试验箱后，在5min内工作空间就能达到所规定的温度值。

3.4试验样品的安装和支撑架的导热率应低，以保证试验样品与安装和支撑架间处于一种绝热状态。

4、 试验程序

4.1初始检测

在试验的标准大气条件下，按有关标准的规定对试验样品进行外观检查和性能检测。

4.2试验 样品的安装

试验样品的安装由有关标准规定，当装入冷热冲击试验箱时，应使气流畅通无阻地穿过及绕过试验样品。

4.3试验

4.3.1将试验样品置于低温箱中，此时，低温箱的温度已调至表1规定的极值温度，并在此温度下按表2规定的时间进行保温。

4.3.2保温 时间到，在5min内将试验样品从低温箱移至高温箱中。此时，高温箱的温度已调至表1规定的极值温度，并在此温度下按表2规定的时间进行保温。

4.3.3保温时间到，在5min内将试验样品从高温箱移至低温箱中。此时，低温箱的温度已调至4.3.1款的极值温度，并在此温度下按4.3. 1款的试验时间进行保温。

4.3.4按表1规定的循环次数，重复4.3.1至4.3.3款。一次循环包括表1中的步骤1至步骤4。

初的5次循环应连续地进行。5次循环后，在任何一次循环完成之后都可以中断试验。再恢复试验之前可允许试验样品恢复到试验的标准大气条件。

4.4中间检测

由有关标准规定

4.5 恢复

后循环结束，试验样品置于试验的标准大气条件下达到温度稳定。4.6 后检测

按有关标准规定对试验样品进行外观检查和性能测量。

5、 失效数据

由有关标准规定。

6、 采用本标准时应规定的细则

a.安装方法(见4.2条);

b.以字母为代号的试验条件(见4.3.1.4.3.2及4.3.4款);c. 初始、 中间及后检测(见4.1.4.4及4.6条)。

